



제25회 한국반도체학술대회

The 25th Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 7일(수), 16:15-17:30

Room J (육백, 6층)

N. VLSI CAD 분과

[WJ4-N] Test & Reliability

WJ4-N-1 16:15-16:30	A New Scan Architecture for Concurrent Test Using IEEE Std. 1687 장석준, 임현찬, 강성호 <i>Department of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University</i>
WJ4-N-2 16:30-16:45	3D Memory의 Reliability 향상을 위한 Data Migration Methods
WJ4-N-3 16:45-17:00	IEEE 1687 표준 기반의 HBM 테스트 플랫폼 Kyeong Cheol Kang, Jin Uk Kim, Yong Jun Choi, and Sung Ju Park <i>Department of Computer Engineering, Hanyang University</i>
WJ4-N-4 17:00-17:15	두 개의 보호 수준을 갖는 오류정정부호 So-Yeon Kang, Joon-Sung Yang <i>Department of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University</i>
WJ4-N-5 17:15-17:30	이중 캐시 개념을 활용한 ECC 기법 최적화 Jung Min You, Joon-Sung Yang <i>Department of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University</i>